

2024 年度 第 16 回 LSI テストセミナー

日時：2025 年 3 月 4 日（火）9 時～21 時

場所：電気ビル共創館カンファレンス E

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 2-1-82 電気ビル共創館 3F

TEL: 0120-222-084

9 時～9 時 10 分 会場設営・受付

9 時 10 分～9 時 15 分 オープニング 大竹 哲史（大分大）

9 時 15 分～9 時 45 分

2 サイクルゲート網羅故障の動的テスト圧縮の効率化

○日向野隼多，溝田桃菜，細川利典（日本大），吉村 正義（京都産業大），新井雅之（日本大）

9 時 45 分～10 時 15 分

論理合成技術を応用した故障検出条件の縮約手法について

○松永裕介（九州大）

10 時 15 分～10 時 45 分

完全故障検出効率と完全診断分解能達成のためのテストパターン置換の高速化手法

○青野達哉，細川利典（日本大），吉村正義（京都産業大），山崎浩二（明治大）

10 時 45 分～10 時 55 分

休憩

10 時 55 分～11 時 25 分

SBST を用いた劣化検知のための時間-デジタル変換器の FPGA 実装

○高橋聖人，大竹哲史（大分大）

11 時 25 分～11 時 55 分

LSI のリバースエンジニアリングを行う際の回路記述中のデータパスとコントローラの分類手法

戸塚寛翔，○吉村正義（京都産業大）

11 時 55 分～12 時 25 分

耐ソフトウェア記憶素子の機能検証に関する研究

○渕上天翔，Stefan Holst，宮瀬紘平，温暁青（九州工業大）

12 時 25 分～13 時 40 分

休憩

13 時 40 分～14 時 20 分

EVA100 についての紹介

○金光相基（アドバンテスト九州システムズ）、

14 時 20 分～14 時 50 分

データパスのハードウェア要素のテスト並列化のためのドントケア割当てアルゴリズム

○徳田晴太，細川利典（日本大），吉村正義（京都産業大），新井雅之（日本大）

14 時 50 分～15 時 20 分

FPGA 実装リングオシレータの温度特性評価と温度推定

○松藤希更，大竹哲史（大分大）

15 時 20 分～15 時 30 分

休憩

15 時 30 分～16 時

LLM を用いた AES 回路の生成と評価

伊藤 彩，○吉村正義（京都産業）

16 時～16 時 30 分

故障診断容易化レジスタバインディングアルゴリズム

○久保倉修司，細川利典（日本大），山崎浩二（明治大），吉村正義（京都産業大）

16 時 30 分～17 時

FPGA の寿命延長のためのコンフィギュレーション生成法

○植山翔太，大竹哲史（大分大）

17 時～17 時 30 分

○緒方佑成，山下友哉，宮瀬紘平，温暁青（九州工業大）

疑似論理関数解析を用いた発生頻度の低いホットスポット特定に関する研究

休憩・諸連絡（17 時 30 分～18 時）

18 時～21 時

LSI テストに関する討論